



Instrumento de control de calidad

## X-Rite Ci™4200 / Ci™4200UV

Espectrofotómetro de sobremesa

Un espectrofotómetro de sobremesa, fiable y preciso, que sirve como base para los procesos que buscan establecer un programa de control del color o para mejorar un programa existente, que se basa presentemente en dispositivos de medición espectral o en métodos de inspección visual del tipo pasa/falla.

Los espectrofotómetros Ci4200/Ci4200UV establecen un nuevo estándar de rendimiento y, por su calidad de instrumentos compactos, con geometría esférica de medición, son una solución fácil de utilizar cuando se combinan con una oferta escalonada de las aplicaciones Color QC y Formulation para aumentar sus funciones y dar soporte a un creciente programa de control de color.



**NEURTEK**

Políg.Ind.Azitain, Parcela 3 A ✉ Apdo.399 20600 EIBAR SPAIN ☎ 902 42 00 82 FAX 943 82 01 57  
Emails: comercial@neurtek.es sat@neurtek.es Web: www.neurtek.com



## Características de los instrumentos X-Rite Ci4200/ Ci4200UV

- El software integrado NetProfiler les permite a los usuarios monitorear el rendimiento de todos los instrumentos existentes, lo que optimiza la compatibilidad de las mediciones y la certificación remota del desempeño
- Compatibilidad de datos con otros instrumentos portátiles de X-Rite con geometría esférica
- Calibración de UV disponible (Ci4200UV) para mantener la precisión de las mediciones entre las muestras aclaradas ópticamente.
- Valor de brillo a 60° correlacionado
- Compatibilidad con transformación incorporada
- LED de membrana le proporciona información sobre el estado y el funcionamiento del instrumento con activación remota
- Colocación y visualización de las muestras por medio de un brazo específico
- Medición simultánea de los componentes especulares incluido y excluido (SCI/SCE) en 2 segundos
- Posicionamiento horizontal y vertical

## Especificaciones del instrumento X-Rite Ci4200

<b>Geometría de medición</b>	d/8°, mecanismo espectral DRS, SPIN/ SPEX (especular incluido/excluido) simultáneos
<b>Abertura de medición</b>	área de medición 8 mm, ventana de mira 14 mm
<b>Fuente de luz</b>	lámpara de tungsteno en atmósfera de gas, LED UV (Ci4200UV)
<b>Receptor</b>	fotodiodos azules de silicio
<b>Rango espectral</b>	400 nm – 700 nm
<b>Intervalo espectral</b>	10 nm – medido, 10 nm – salida
<b>Rango de medición</b>	0 a 200% de reflectancia
<b>Compatibilidad entre instrumentos</b>	CIE L*a*b*: Promedio 0.20 0.20 ΔE*ab, basado en el promedio de 12 cerámicas BCRA series II (componente especular incluido), máx. de 0.40 ΔE*ab en cualquier cerámica (componente especular incluido)
<b>Repetibilidad a corto plazo</b>	0.05 ΔE*ab en cerámica blanca.
<b>Tiempo de medición</b>	2 segundos, aproximadamente
<b>Compatibilidad con transformación</b>	incorporada
<b>Duración de lámpara</b>	500.000 mediciones, aprox.
<b>Suministro de energía</b>	Requisitos del adaptador de CA 90 - 130 V AC o 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 15 W máx.
<b>Interfaz de datos</b>	USB
<b>Rango de temperatura operacional</b>	50° a 104°F (10° a 40°C), máximo de 85% humedad relativa (no condensante)
<b>Rango de temperatura de almacenamiento</b>	-20° a 50° C (-4° a 122° F)
<b>Peso</b>	5,2 kg (11.5 lb)
<b>Dimensiones</b>	22,0 cm (8,7") alto x 19,0 cm (7,5") ancho x 26,4 cm (10,4") largo
<b>Accesorios incluidos</b>	Estándares de calibración: colector negro, estándares blanco y verde, estándar de calibración (Ci4200UV), manual de uso, adaptador de CA, cable USB



X-RITE - SEDE CENTRAL Grand Rapids, Michigan USA • (800) 248-9748 • +1 616 803-2100 • xrite.com  
© 2013, X-Rite, Incorporated. Reservados todos los derechos. L10-479 (04/13)

